

บทที่ 5

การเตรียมผิวสัมผัสโอห์มมิก

เงื่อนไขวัสดุเริ่มต้น

แวนผลึกแคลเลียมอาร์เซไนด์ ชนิดเอ็น

| | |
|--------------------------|--|
| ปลูกด้วยวิธี | Horizontal Bridgman |
| โตไปด้วย | ซิลิคอน (Silicon) |
| ความหนาแน่นของพาหะ | $2.9-3.1 \times 10^{18}$ ต่อลบ.ซม. |
| สภาพต้านทาน | $1.8-2.0 \times 10^{-3}$ โอห์ม-ซม. |
| สภาพความคล่องตัวของพาหะ | $1.8-2.0 \times 10^3$ ตร.ซม./โวลต์.วินาที |
| E.P.D. | Class C |
| ทิศทางผลึก (Orientation) | [100] 2° off (110) $\pm 0.5^\circ$ |
| ความหนาของผลึก | 359-361 ไมครอน |
| ขนาด | 1000 D Standard |
| ลักษณะผิวหน้า | ผิวหน้าด้านหนึ่งขัดมัน อีกด้านหนึ่งไม่ขัดมัน |

แวนผลึกแคลเลียมอาร์เซไนด์ ชนิดพี

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ทิศทางผลึก (Orientation) | [100] |
| โตไปด้วย | สังกะสี |
| ความเข้มข้นพาหะ | $2.0-2.4 \times 10^{18}$ /ลบ.ซม. |
| เกรด (Grade) | LASER DIODE TYPE |

โลหะที่ใช้ในการสร้างผิวสัมผัสโลหะ-สารกึ่งตัวนำ

โลหะผสมทอง-เจอร์เมเนียม (Au-Ge) (88%:12%) และนิกเกิล (Ni) สำหรับ
แคลเลียมอาร์เซไนด์ชนิดเอ็น

โลหะผสมทอง-สังกะสี (Au-Zn) (95.5%:4.5%) สำหรับแกลเลียมอาร์เซไนด์ชนิดพี

ขั้นตอนของการสร้างผิวสัมผัสโลหะ-สารกึ่งตัวนำ

รายละเอียดของขั้นตอนการสร้าง จะถูกแสดงเป็นข้อๆต่อไปนี้ พร้อมกับ Flow chart ในตอนท้าย

1. เตรียมแว่นผลึกแกลเลียมอาร์เซไนด์ ทั้งชนิดเอ็นและพี แว่นผลึกเหล่านั้นจะต้องถูกทำความสะอาดผิวก่อน เนื่องจากมีชั้นออกไซด์บางๆของแกลเลียมออกไซด์ (Ga_2O_3) เกิดขึ้นตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังอาจจะมีรอยขีดข่วนต่างๆบนผิว สำหรับขั้นตอนของการเตรียมผิวนี้นี้เป็นวิธีการทางเคมี ซึ่งแสดงไว้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5.1

ขั้นตอนการเตรียมผิวแว่นผลึกแกลเลียมอาร์เซไนด์

| อันดับที่ | สารละลายที่ใช้ | จุดประสงค์ |
|-----------|---|--|
| 1 | ต้มใน Trichloethylene เดือด เป็นเวลา 5 นาที | ล้างคราบไขมัน |
| 2 | ต้มใน Acetone เดือด เป็นเวลา 5 นาที | ล้าง Tricholethylene ที่หลงเหลือ |
| 3 | น้ำ DI | ล้าง Acetone |
| 4 | เป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน | |
| 5 | $4 \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 (30\%) + \text{H}_2\text{O}$ ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที | กัดออกไซด์ที่ผิวและ ขัดผิวให้เงามัน |
| 6 | น้ำ DI | |
| 7 | กรดเกลือ (HCl) 50% | กัดออกไซด์ที่หลงเหลือ |
| 8 | น้ำ DI | ล้างกรดเกลือ |
| 9 | เป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน | |

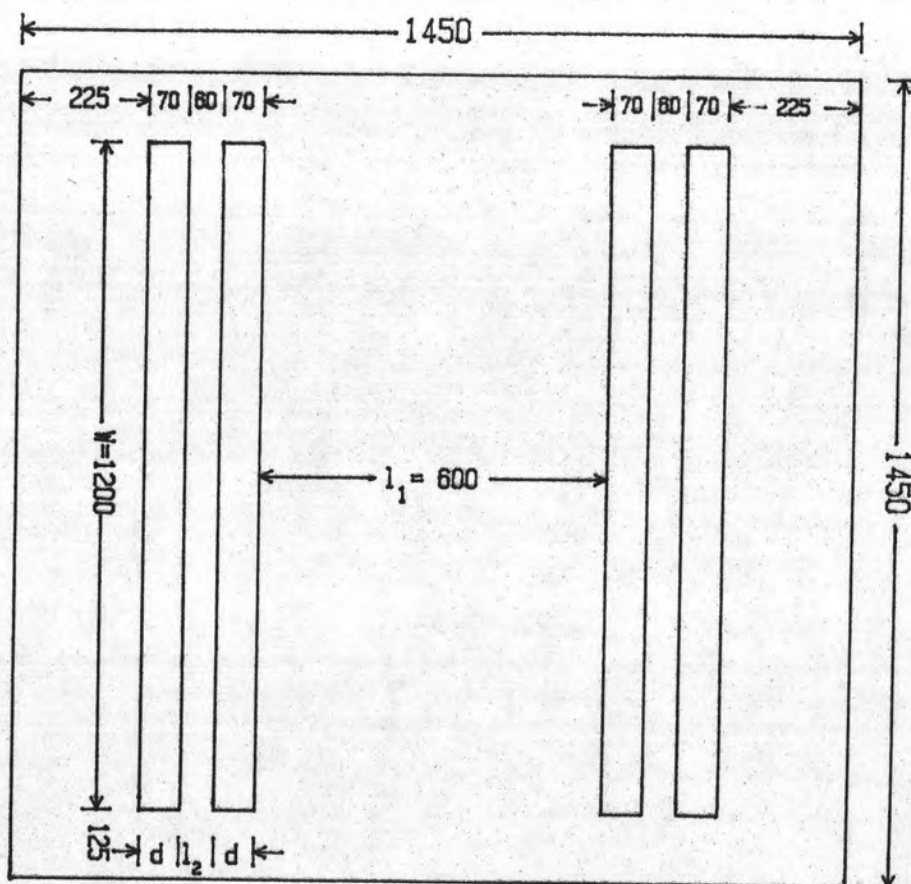
2. ฉาบผิวโลหะบนแกลเลียมอาร์เซไนด์ โดยการใช้นิ่ว Filament Evaporation ภายใต้อัตราความดันต่ำกว่า 10^{-5} Torr ด้วยโลหะดังต่อไปนี้

แวนผลิกชนิดเอ็น ฉาบ Au-Ge หนา 300 Å ตามด้วย Ni หนา 200 Å

แวนผลิกชนิดพี ฉาบ Au-Zn หนา 2000 Å

ความหนาโลหะที่ใช้เป็นเงื่อนไซท์ที่เหมาะสมสำหรับ n-GaAs เพื่อให้การแพร่ซึมของนิเกิลมีผลสูงสุด แต่กรณีสำหรับ p-GaAs นั้น โลหะผสมทอง-สังกะสีมีความอ่อนนุ่ม เพื่อให้คงทนต่อแรงกดที่เกิดขณะต่อสายด้วยเครื่องต่อสายอุลตราโซนิค จึงต้องฉาบโลหะหนากว่า

3. ถ่ายแบบผิวสัมผัสไอห้มมิก แบบ 4 ผิวสัมผัส (Contacts) ด้วยหน้ากาก (mask) ซึ่งได้เตรียมเอาแล้วในตอนต้น โดยใช้เครื่องถ่ายแบบ (Mask aligner) ดังรูปที่ 5.1 สามารถถ่ายแบบดังกล่าวลงบนผิวหน้าโลหะ เพื่อเป็นหน้ากากกันการกัด (Etch) ของสารเคมี ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า Photolithography โดยละเอียดมีดังต่อไปนี้



รูปที่ 5.1 รูปแบบของตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง (หน่วยเป็นไมครอน)

- 3.1 ล้างแวนผลึกที่ผ่านการฉาบผิวโลหะแล้วด้วย Trichloethylene , Acetone , น้ำ DI และเป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน ตามลำดับ
- 3.2 อบแวนผลึกที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที เพื่อไล่ความชื้น จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่
- 3.3 เคลือบน้ำยาไวแสงแบบบวก (Positive photoresist) AZ 1350 ของ Shipley โดยปั่นแวนผลึกด้วยเครื่องปั่น (Spinner) ที่ความเร็ว 5000 รอบ/นาที เป็นเวลา 20 วินาที
- 3.4 อบแวนผลึกที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เพื่อทำให้อากาศที่เคลือบไว้แข็งตัวและทิ้งเย็นไว้สักครู่ ซึ่งการอบในขั้นนี้เรียกว่า Soft bake
- 3.5 นำแวนผลึกที่เคลือบน้ำยาไวแสงไปฉายแสงเหนือม่วงโดยมีหน้ากาก (Mask) ที่มีรูปแบบที่ต้องการปิดบนแวนผลึกเป็นเวลานาน 10 วินาที เป็นการถ่ายแบบจากหน้ากากลงบนแวนผลึก แต่แบบ (Pattern) ที่ถ่ายนั้นจะยังไม่ปรากฏให้เห็นในขั้นนี้
- 3.6 จากนั้นนำแวนผลึกนั้นไปล้าง (Develop) ในสารละลายที่เรียกว่า Photoresist developer เพื่อกัดเอาสารไวแสงส่วนที่ถูกแสงออก จะได้แบบ (Pattern) เหมือนหน้ากากที่ใช้ในการถ่ายแบบจากขั้นที่ 3.5 ปรากฏขึ้นบนแวนผลึก ซึ่งเป็นสารไวแสงส่วนที่ไม่ถูกแสงยังคงเหลืออยู่ จากนั้นล้างคราบ developer ด้วยน้ำ DI และเป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน
- 3.7 อบแวนผลึกที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15-20 นาที เพื่อทำให้อากาศส่วนที่เหลืออยู่ติดกับผิวแวนผลึกแน่นขึ้น ซึ่งในขั้นนี้เรียกว่า Hard bake
4. การกัดโลหะ (Etching)
- แวนผลึกชนิดเอ็น
- กัด Ni ด้วย HCl เข้มข้น 1-2 นาที
- กัด Au-Ge ด้วย KI+I₂ เจือจาง 10 วินาที
- แวนผลึกชนิดพี
- กัด Au-Zn ด้วย KI+I₂ เจือจาง 10 วินาที
5. ล้าง photoresist ด้วย Acetone และ น้ำ DI แล้วเป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน ตามลำดับ

6. แอนเนลในบรรยากาศของ Forming Gas N_2+H_2 โดยมีเงื่อนไขของการแอนเนลดังต่อไปนี้

6.1 แกลเลียมอาร์เซไนด์ชนิดเอ็น มีเงื่อนไขของการทดสอบอิทธิพลของเวลาโดยกำหนดอุณหภูมิ 3 ค่าคือ 450 องศา 475 องศาและ 500 องศาเซลเซียส ซึ่งในแต่ละอุณหภูมิแปรเปลี่ยนเวลา 5 ค่าตั้งแต่ 30 วินาทีถึง 2 นาที 30 วินาที ซึ่งแต่ละช่วงห่างกัน 30 วินาที

6.2 แกลเลียมอาร์เซไนด์ชนิดพีนั้นกำหนดอุณหภูมิที่ 500 องศาเซลเซียสด้วยเวลาตั้งแต่ 2-8 นาที ในบรรยากาศ Forming Gas

ซึ่งในบรรยากาศ Forming Gas จะประกอบด้วยก๊าซสองชนิดคือไฮโดรเจนและไนโตรเจน โดยก๊าซไนโตรเจนนั้นเป็นก๊าซเฉื่อยทำหน้าที่ผลัดดันและปกคลุมผิวโลหะเอาไว้ และไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่หลงเหลืออยู่เป็นการสกัดจับออกซิเจนที่ผิวของโลหะอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน (Oxidation) ที่ผิวโลหะ

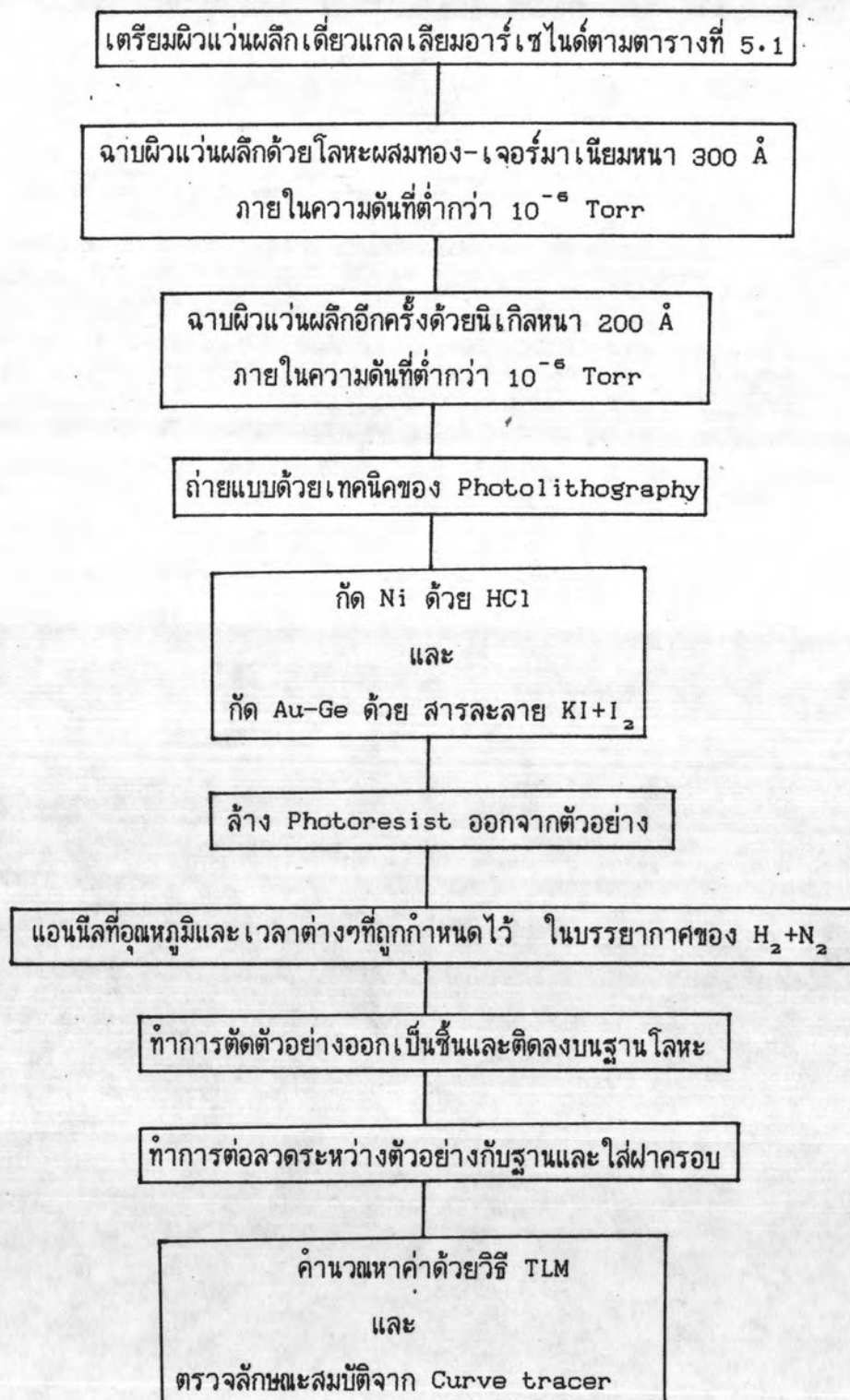
7. การตัดแยกชิ้นตัวอย่าง (Device Separation) เป็นการทำตัดตัวอย่างที่สร้างขึ้นออกเป็นตัวอย่างด้วยเทคนิคของกรีดด้วยหัวเพชร (Diamond Scribing)

8. ติดชิ้นของตัวอย่าง (Die) ลงบนฐานโลหะแบบ TO-5 โดยใช้สาร Epotex แล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที

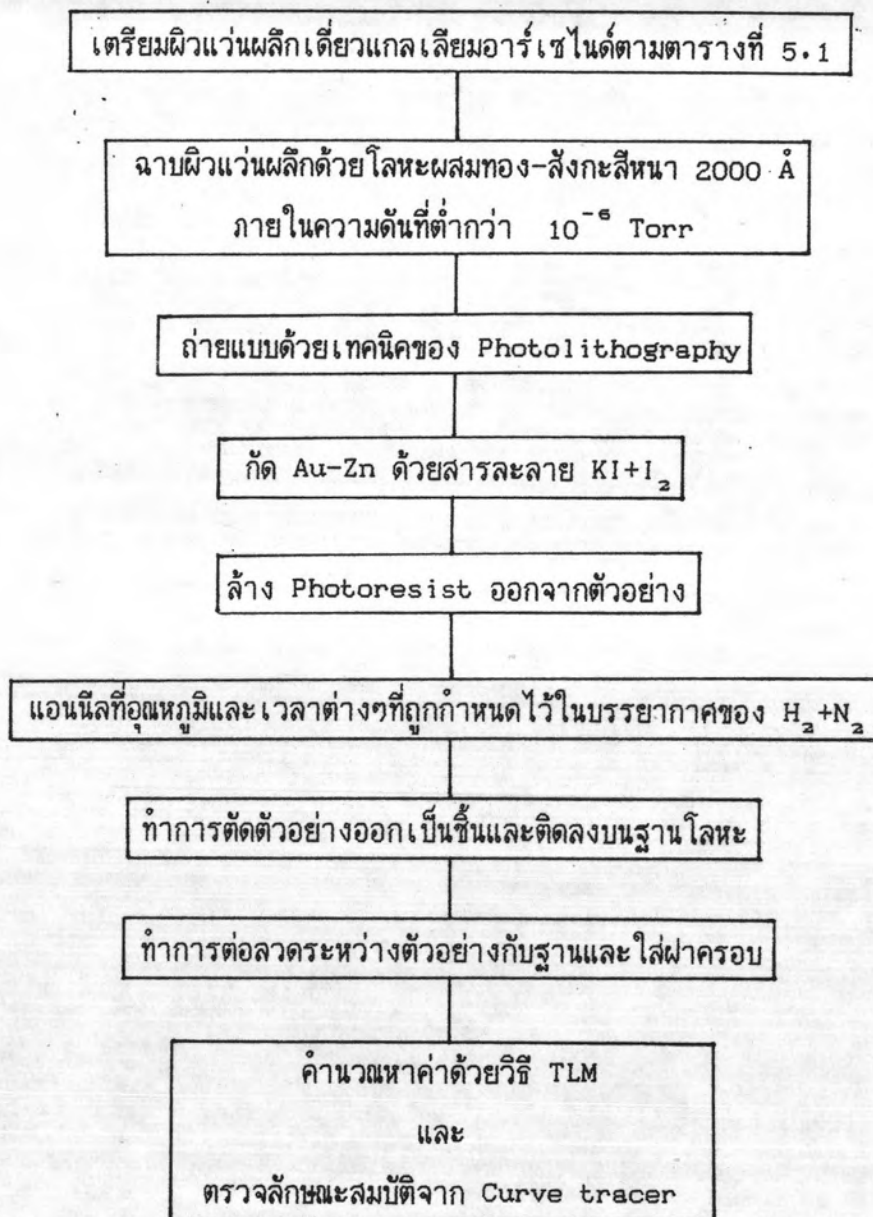
9. การติดลวดต่อสายโลหะ (Wire Bonding) การติดลวดโลหะอะลูมิเนียม (Al) ด้วยเครื่องต่อสายอัลตราโซนิก (Ultrasonic Wire Bonding)

10. ปิดฝาครอบโลหะของ TO-5

11. จากตัวอย่างที่ได้สร้างขึ้นนำมาทำการวัดค่าความต้านทานจำเพาะผิวสัมผัสด้วยวิธี TLM ตามที่กล่าวมาในบทที่ 4



รูปที่ 5.2 แผนลำดับการสร้างตัวอย่างการทดลองจากแกลเลียมอาร์เซไนด์ชนิดเอ็น



รูปที่ 5.3 แผนลำดับการสร้างตัวอย่างการทดลองจากแกลเลียมอาร์เซไนด์ชนิดนี้